



## Resmap 178

Resmap178 型四点探针测试仪是专门为半导体生产企业设计的一款产品。提供可靠, 准确和重复性好的四点探针测试技术。Resmap178 已经在半导体电池衬底和导电薄膜上证明了其测试电阻率的可靠能力。

晶片传送	手动加载	电脑系统	奔腾系列; windows XP 家用 (不带显示)
晶片尺寸	125mmx 125mm 156mm x 156mm 直径 2" - 8"	SECS-II 选项	有
最大面积	156mm x 156mm	画图模式	方形或矩形图 (排除内侧边界);线扫描 (直径, 半径或沿直径任意点, 最小步长 0.1 毫米点), 用户自定义 (模板)
典型测量时间	每秒 1 点	平面图	等高线 (间距选择, $1/3\sigma$ , 固定和自动%), 3D, 线, 数据图, 直方图, 数据序列, 径向和角分布, 趋势图的不同模式可供选择
最大输出	每分 1 个晶片 (49 点)	数据	所有 ResMap 数据文件可以复制到如 Excel® 进行进一步的分析。
测量范围	2 mΩ/□ - 1 0 MΩ/□ (可以优化为 1 mΩ/□)		
重复率 (1σ, 典型):	≤ ±0.02% (静态或 Rs) ≤ ±0.1% (动态附近点)		
准确度	±0.5% 采用 NIST 可追溯性 ResCal 标准		
最小边界条件 (排除范围)	1.5 毫米 (探针中心到膜边缘距离)		

## 设备

中央吸尘系统	不要求真空
交流功率	100V to 240V < 10 KVA

尺寸 (英尺) 宽*深*高	12" w x 19" d x 10" h; 桌面 (不包括桌面)
------------------	--------------------------------------